Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0516U000717

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-10-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коструба Андрій Михайлович
2. Kostruba Andriy Mykhaylovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.05

Назва наукової спеціальності: Оптика, лазерна фізика

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 01-09-2016

Спеціальність за освітою: 8.070101

Місце роботи здобувача: Львівська комерційна академія

Код за ЄДРПОУ: 01597980

Місцезнаходження: 79005 м.Львів вул.Туган-Барановського, 10

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство зовнішних економічних зв'язків і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35.071.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 19173602

Місцезнаходження: Драгоманова, 23, м. Львів, Львівська обл., 79005, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 19173602

Місцезнаходження: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.31.27, 59.41.33

Тема дисертації:

1. Еліпсометрія ультратонких плівкових структур

2. Ellipsometry of ultrathin film structures

Реферат/анотація:

1. Вперше вирішено проблему незалежного визначення товщини і показника заломлення прозорих ультратонких плівкових структур в умовах низького оптичного контрасту на поверхні плівка-підкладка. Запропоновано оригінальний метод вимірювань і розв'язування оберненої задачі еліпсометрії для системи "ультратонка прозора плівка - прозора підкладка" в діапазоні товщини 1,0-20,0 нм. Вперше показано, що методика розрахунку середньоквадратичної похибки дозволяє об'єднати аналіз чутливості еліпсометричних вимірювань із кореляційним аналізом при одночасному визначенні трьох параметрів ультратонкої поглинаючої плівки. Проведено апробацію запропонованих методик.

2. The main result is solving the problem of independent determination of the thickness and the refractive index of transparent ultra-thin film structures under conditions of low optical contrast on the film-substrate surface. Original methods for the measurements and the solution of the inverse ellipsometry problem are suggested for the

system "ultra-thin transparent film - transparent substrate" in the thickness range 1.0-20.0 nm. It is shown that the method elaborated by us for calculating standard error allows one to combine the sensitivity analysis for the ellipsometry measurements with the correlation analysis whenever the three parameters of ultrathin absorbing films are determined. All proposed methods were approbated.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Влох Ростислав Орестович
2. Vlokh Rostyslav Orestovych

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Одулов Сергій Георгійович
2. Одулов Сергій Георгійович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ушенко Олександр Григорович
2. Ушенко Олександр Григорович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кушнір Олег Степанович
2. Кушнір Олег Степанович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Влох Ростислав Орестович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Влох Ростислав Орестович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.